

Perbaikan proses perakitan YC-439S (TR) dengan menerapkan konsep lean = Assembling process improvement of YC-439S (TR) by implementing the concept of lean

Rifi Wijayanti Dual Arifin, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20250326&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian proses perakitan YC-439S(TR) yang dianalisa berdasarkan proses dengan nilai tambah dan proses tanpa nilai tambah. Proses nilai tambah merupakan proses yang memberikan suatu nilai pada produk. Sedangkan proses tanpa nilai tambah adalah proses yang terjadi namun tidak menambah nilai pada suatu produk. Proses tanpa nilai tambah di kategorikan menjadi dua kategori yakni pemborosan akibat proses desain dan pemborosan selama proses perakitan berlangsung. Dalam menganalisa pemborosan akibat proses desain digunakan metode Line Architecture Desain Methodology (LADM) yang merupakan bagian dari konsep Lean. Adapun konsep lean lain yang digunakan adalah pemetaan perakitan dengan VSM dan analisa pergerakan proses dengan metode Method Time Measurement. Sehingga hasil dari analisa-analisa tersebut adalah melakukan perbaikan pada proses yang membutuhkan agar dapat mengurangi pemborosan serta penghematan yang didapat setelah melakukan perbaikan.

.....Assembling process examination of YC-439S(TR), which is analyzed based on the value-added process and no value-added processes. The process of value-added is a process that gives a value to the product. While the no value-added process is a process that occurs but does not adding a value to a product. The no value-added process are categorized into two categories, waste that issued by design process and waste during the assembly process. One of Lean concept, Line Architecture Design Methodology (LADM), was used in analyzing waste that issued by design process. As for another lean concept, VSM was used to map the assembly process and Method Time Measurement was used to analyze the movement process. Thus, to execute improvements in order to reduce the waste and improvement saving are the output of these analytical.